附件四、技術說明表

一種進階影像分析方法

提案人： 王偉仲 教授
單　位： 國立臺灣大學　應用數學科學研究所
簡　歷：（可列出相關連結，例如系所、研究室網頁）
https://www.math.ntu.edu.tw/entity_people/entity_people/21468

市場及需求： 本案應用場域為有電腦斷層影像掃描與分析之需求場域，如醫療院所、健檢中心、部分診所等，本技術可作為胰臟癌判讀之輔助診斷技術。

技術摘要(含成果)： 本技術為輔助診斷工具，可辨別不同電腦斷層影像上是否有胰臟癌，並可標註出胰臟癌位置，以輔助使用者進一步診斷。

優勢： 本 AI 技術可以大幅提升胰臟癌症的電腦斷層診斷應用範圍，並準確定位電腦斷層檢查中的可疑區域。本技術在實際臨床應用中可為臨床醫生提供重要的診斷輔助，協助他們做出更精確判斷和有效的管理決策。

競爭產品： 目前市面無類似品。

專利現況： 本技術目前已申請美國專利臨時案。

聯絡方式(請不用填)：
臺大產學合作總中心
Tel: 02-3366-9945,　E-mail: ordiac@ntu.edu.tw

An advanced image analysis method

PI： Prof. Weichung Wang
Department of Mathematics and Data Science Degree Program, National Taiwan University.

Experience:
https://www.math.ntu.edu.tw/entity_people/entity_people/21468

Market Needs: This technology applies to fields requiring CT scan imaging and analysis, such as medical institutions, health examination centers, and specific clinics. It serves as an auxiliary diagnostic tool for pancreatic cancer interpretation.

Our Technology: This technology is an auxiliary diagnostic tool for identifying pancreatic cancer in different CT scan images. Additionally, it can highlight the location of pancreatic cancer to assist users in further diagnosis.

Strength: This AI technology significantly expands the application scope of CT-based pancreatic cancer diagnosis and accurately pinpoints suspicious areas in CT scans. In clinical practice, it provides crucial diagnostic support to physicians, helping them make more precise judgments and effective management decisions.

Competing Products: There are currently no similar products on the market.

Intellectual Properties: This technology has applied for a U.S. provisional patent.

Contact (do not need to fill out):
Center for Industry-Academia Collaboration, NTU
Tel: 02-3366-9945, E-mail: ordiac@ntu.edu.tw